

Центр коллективного пользования «Новые функциональные материалы и наноматериалы, высокочистые вещества»

V. Металлографический анализ

1. Анализ изображений поверхности образца с высоким пространственным разрешением с использованием режима вторичных электронов, картирование распределения элементного и химического состава в Оже-электронах и анализ профиль концентрации вдоль выбранной линии (линейный профиль) с нанометрическим и субнанометрическим разрешением..

Решение фундаментальных и прикладных задач в области исследования и контроля химического и фазового состава, формы и структуры наноматериалов и изделий из них, а также макрообъектов имеющих наноразмерные структурные составляющие.

Оже-микроанализатор JEOL JAMP-9500f.

JEOL JAMP-9500f с полусферическим анализатором.

Параметры:

Возможно проведение анализа профиля концентрации по глубине при использовании ионного (Ar⁺) травления поверхности образца.



Руководитель ЦКП: к.х.н., зав. лабораторией № 6 Дарья Геннадьевна Филатова
Заместитель руководителя ЦКП: научный сотрудник Павел Андреевич Быков
e-mail: imet_lab@mail.ru